



Microscopía

ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DE MATERIALES

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS
MICROSCÓPICO,
MORFOLOGÍA,
MICROESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

La Microscopía Óptica, Electrónica (SEM, TEM) y de Fuerza Atómica (AFM) pueden emplearse para estudiar la microestructura, morfología, tamaños de partículas y presencia de defectos en los materiales a escala micrométrica y nanométrica.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE:

Microscopio Óptico con modo reflexión, transmisión y polarización, con platina calefactora
Microscopio Electrónico de Barrido acoplado con detector para Microanálisis Dispersivo de R-x
Microscopio Electrónico de Transmisión
Microscopio de Fuerza Atómica

APLICACIONES

Nanopartículas
Películas poliméricas delgadas y laminados multicapas
Recubrimientos
Compuestos y nanocompuestos
Huecos, grietas y defectos
Estructura cristalina

CONTACTÉNOS

ott@plapiqui.edu.ar

[Universidad Nacional
del Sur](#)